

MIKROUKŁADY SCALONE	NORMA BRANŻOWA	BN-76
	Cyfrowe układy scalone <b>Metoda pomiaru napięcia na tranzystorze wyjściowym <math>U_{BE(Q)}</math></b>	3375-24 Arkusze 15
		Grupa katalogowa XIX 25

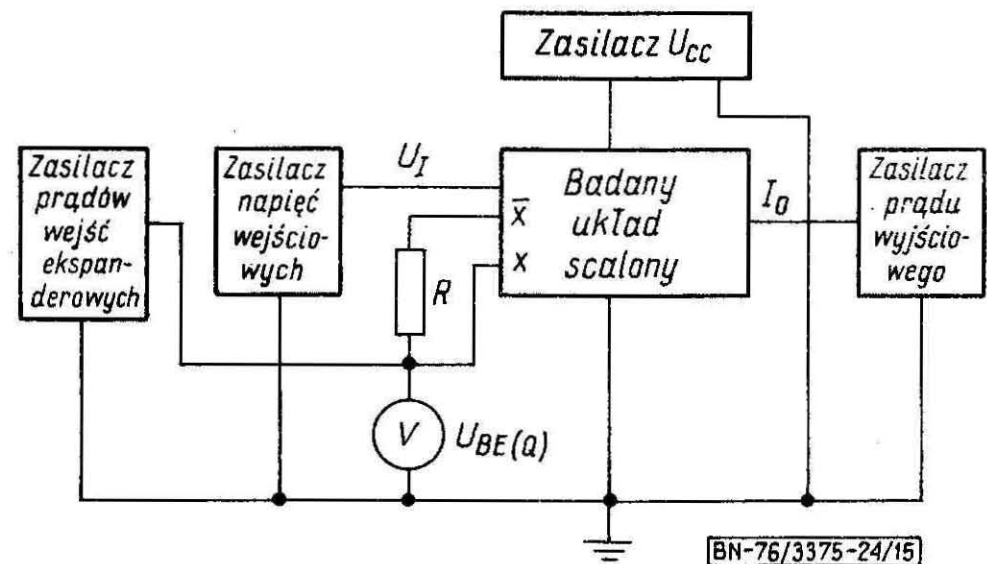
**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest metoda pomiaru napięcia baza-emiter tranzystora wyjściowego  $U_{BE(Q)}$  układów z wejściem ekspanderowym.

**2. Warunki pomiaru.** Pomiar należy przeprowadzać dla warunków najgorszego przypadku.

Norma przedmiotowa powinna zawierać następujące warunki określające dany pomiar:

- a/ układ pomiarowy,
- b/ napięcie zasilania dla warunków najgorszego przypadku,
- c/ napięcia wejściowe dla warunków najgorszego przypadku,
- d/ wartość prądu wyjściowego  $I_O$ ,
- e/ wartości oporności pomiędzy wejściami ekspanderowymi,
- f/ wartość prądu wymuszonego na wejściu  $X$ ,
- g/ warunki klimatyczne otoczenia.

**3. Układ pomiarowy** - wg rysunku.



**4. Przebieg pomiaru**

- a/ wstawić układ badany do podstawki pomiarowej,
- b/ ustawić temperaturę otoczenia badanego układu zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej,
- c/ ustawić napięcia zasilające zgodnie z warunkami najgorszego przypadku, podane w normie przedmiotowej,
- d/ ustawić napięcia wejściowe dla warunków najgorszego przypadku, zgodnie z normą przedmiotową,
- e/ ustawić stan na wyjściu zgodnie z normą przedmiotową,
- f/ ustawić stany na wejściach ekspanderowych,
- g/ zmierzyć napięcia baza-emiter  $U_{BE(Q)}$ .

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** - Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników.

**2. Autorzy projektu normy** - mgr inż. Adolf Cuper, mgr inż. Jan Lesiński - Instytut Technologii Elektronowej NPCP.

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników  
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego dnia 27 lipca 1976 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 marca 1977 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1976 poz. 68)